

日本信頼性学会誌「信頼性」
Vol.39 No.5 2017.9月号
(通巻237号)

目 次

お知らせ	i
目 次	xiii
卷 頭 言	
論文投稿のすゝめ.....	弓削 哲史 261
展 望	
「高品質を要求する LSI テスト技術」	
LSI テスト技術の新潮流－人工知能をどう活用するか?	中村 芳行 262
高信頼 LSI の品質確保のためのテスト手法について	松嶋 潤 270
論理回路の遅延テスト品質向上に関する取組み.....	佐藤 康夫 276
LSI の品質を確保すべくどのようにテストするか	畠山 一実 283
IoT 時代の分散型 IC テストシステム	木村 学, 石田 雅裕 291
学会情報	
第 39 回年次総会議事録	総務委員会 297
2017 年度第 2 回理事会 (第 248 回日本信頼性学会理事会) 議事録	総務委員会 304
会員状況.....	306
編集後記	眞田 克 307
広 告	大同信号株式会社 xi
.....	一般財団法人日本科学技術連盟 xii

The Journal of Reliability Engineering Association of Japan
Vol.39 No.5 September 2017

Content

Preface

Encouragement of Submitting Your Paper Tetsushi YUGE 261

Special Survey

“ LSI Testing Technology Demanding High Quality ”

New LSI Test Technology Trend - How to Utilize AI? Yoshiyuki NAKAMURA 262
A Test Method for Quality Assurance of Highly Reliable LSI Jun MATSUSHIMA 270
An Activity for Improvement of Delay Test in Logic Circuit Yasuo SATO 276
How to Ensure LSI Quality by Testing Kazumi HATAYAMA 283
Decentralized IC Test System in the IoT Era Manabu KIMURA, Masahiro ISHIDA 291

From Editor Masaru SANADA 307

Published by Reliability Engineering Association of Japan